

0.1 μm 、28.3 L/min。

スーパークリーンの評価、フィルタのリーク試験に



気中パーティクルカウンタ KC-24

- 半導体レーザ励起固体レーザ採用で、小型・軽量
- ISO 21501-4 (JIS B 9921) 適合
- ISO 14644-1に準じた空気清浄度を、簡単に評価
- リオン多点モニタリングシステムへの組み込みや、チューブ多点システムの構築が可能
- 測定データはCFカード(256 MBが付属)に保存が可能 (CSV形式)
- プリントを本体に取り付けが可能 (工場オプション)

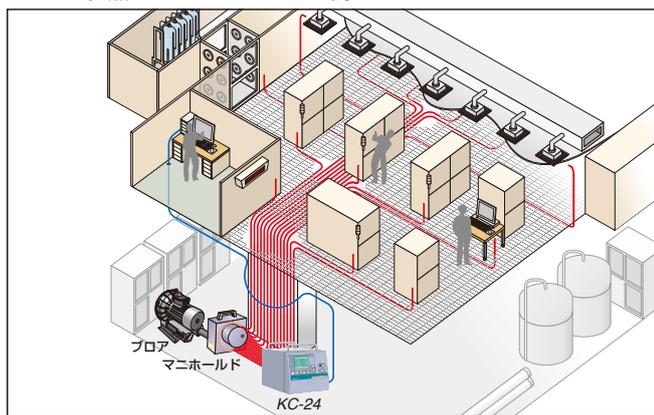


カードスロット部

仕様

光学系方式	側方散乱方式
光源	半導体レーザー励起固体レーザー(波長1064 nm)オープンキャビティ型 半導体レーザー: 波長808 nm, 定格出力1 W/固体レーザー: Nd: YVO ₄
レーザー製品のクラス	クラス1, IEC 60825-1
受光素子	フォトダイオード
定格流量	28.3 L / min
校正	清浄空気中のポリスチレンラテックス(PSL)粒子(屈折率1.6)
最小可測粒径	0.1 μm(ただし、屈折率1.6の球形粒子の場合)
粒径区分(5段階)	0.1 μm, 0.15 μm, 0.2 μm, 0.3 μm, 0.5 μm以上
最大粒子個数濃度	1 000個 / L(計数損失5%以内)、2 000個 / L(計数損失10%以内)
偽計数	7個 / m ³ 以下
測定時間	
任意時間	10秒~2時間(1秒単位で任意設定)
固定体積	10 L, 28.3 L, 100 L, 283 L, 1 000 L
測定モード	
手動測定	STARTボタンで測定開始, STOPボタンで測定終了。その間は連続測定を行う
自動測定	任意時間または固定体積の測定を繰り返し、その平均値を算出。 周期測定平均値測定を、指定した時間ごとに開始
測定値表示	累積値、差分値、体積換算値(1 L, 28.3 L, 1 000 L)
メモリ機能	メモリアカード(CFカード)を使用時、テキスト(CSV形式)で自動保存
清浄度評価機能	ISO 14644-1に従った空気清浄度を評価
ALARM	選択された粒径区分の計数値が設定された警報レベルとなったとき ブザーを鳴らし、ALARM端子間を短絡
表示部	320×240ドットマトリクスタイプ液晶(120×90 mm, バックライト付)
入出力端子	
I/O	コンピュータなどの通信に使用
MANIFOLD	マニホールドコントローラと接続
ALARM	設定された警報レベルとなったとき、端子間を短絡
接続最大負荷	DC30V 1A
使用温湿度範囲	15℃~30℃, 20%~85%RH(結露のないこと)
試料空気温湿度	15℃~30℃(使用温度に対して-4℃から+10℃の範囲) 20%~85%RH(結露のないこと)
電源	AC100V~240V, 50/60Hz 300VA (周囲温度25℃, マニホールド未接続のとき200VA)
大きさ・重さ	280 mm(H)×320 mm(W)×450 mm(D)・19.4 kg
付属品	サンプリング管×1, サンプリングチューブ(ビニールチューブφ11 mm×φ7 mm, 2 m)×1, フィルタ×1, メモリアカード256 MB×1, 電源コード(国内用2.5 m)×1
オプション	メモリアカード 256 MB MC-25CF2 CFカード用アダプタ CFC-ADPO3 通信ケーブル CC-62DA(シリアル・2 m) 感熱記録紙 TP-08 無塵記録紙 TP-10 RPモニタ Evo10 K1701 Ver.2 ※多点モニタリングシステムに関しては、別途お問い合わせください
工場オプション	サーマルプリンタ 外部スタート/ストップ

チューブ多点モニタリングシステム例



測定結果表示例

2004-10-28 Curr CFG	
20:30:58	
Curr CFG	
Time/Volume Meas	Volume Auto
Meas Time	00:01:00
Meas Volume	28.3L
AUG	None
Period Time	None
Alarm Size	0.15000
Alarm Level	0.2
Loc	0.5
	0.5
EXIT	ENTER

設定画面

2004-10-28 Measured	
20:22:45	
2004-10-28 19:26:16	
Size	Counts (Cumu) / 1000L
0.1	317796.6
0.15	254237.2
0.2	190677.9
0.3	127118.6
0.5	63559.3
Loc 0	Meas Time 00:01:00
	NextStart --:--:--
UNIT	DIFF OFFALM NEXT >>

通常測定

2004-10-28 ISO STD Point Eval			
20:38:26			
2004-10-28 20:31:57			
Size	AUG	Class Limit	
0.1	9000.0	100000	PASS
0.15	7200.0	43000	PASS
0.2	5400.0	23700	PASS
0.3	3600.0	10200	PASS
0.5	1800.0	3520	PASS
ISO Class 5			
ROOM1 1 / 2		Meas Time 00:01:00	
AUG ALL(1)		Remained --:--:--	
		PRINT	NXTPNT

ISO 14644-1、正規の評価方法

2004-10-28 ISO SEQ Point Eval			
20:46:09			
2004-10-28 20:40:16 Page 1/2			
Size	Count	Upper	Lower
0.1	3000	9728	9719
0.15			
0.2			
0.3			
0.5			
ISO Class 3			
KEIGI 1 / 10		Determ Period 00:00:10	
ALL		Total Time 00:00:20	
	PAGE	PRINT	NXTPNT

ISO 14644-1、逐次サンプリング評価方法

リオン株式会社

<https://www.rion.co.jp/>

*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。
*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

ISO14001 本社・東海営業所
西日本営業所 認証取得
ISO9001 本社・東海営業所
西日本営業所・九州リオン・
リオンサービスセンター 認証取得



本社 微粒子計測器営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号
TEL(042)359-7878 FAX(042)359-7458

九州リオン(株)

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号
TEL(092)281-5366 FAX(092)291-2847

修理に関するお問い合わせ

リオンサービスセンター(株)

〒192-0918 東京都八王子市兵衛2丁目22番2号
TEL(042)632-1160 FAX(042)632-1140